



FÜR HIGH VOLUME, HIGH MIX LEITERPLATTENPRODUKTION



EAGLE

MTS 180



- > Bis zu 3.456 Pins bei 5.500 N
- > Günstige Adapterlösungen
- > Beidseitiges Testen
- > Schnittstelle für schnelles Wechseln von Adaptern
- > Analoges und digitaler In-Circuit-Test (Low Voltage Technologie), Funktionstest, EOL-Test, Boundary Scan
- > Vektorlose Testverfahren
- > Als Lambda Edition für echtes Paralleltesten erhältlich

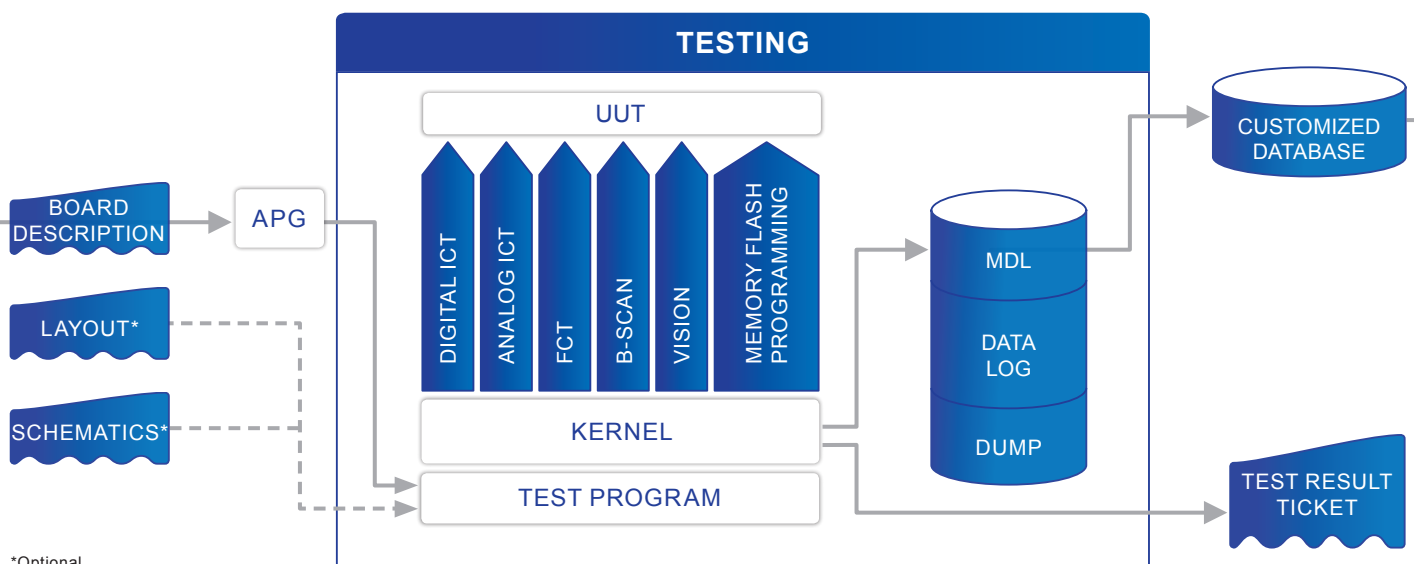


Der Eagle ermöglicht günstiges Testen von hohen Stückzahlen, selbst mit komplexen Adaptern.

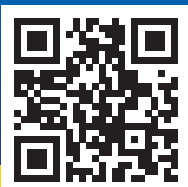


CITE

COMPUTER INTEGRATED TEST ENVIRONMENT



*Optional



EAGLE HARDWARE BASISSYSTEM

Stellfläche	1.000 mm Breite x 1.700 mm Höhe x 860 mm Tiefe
Steuerung	Industrie PC
ICT Messungen (AMU)	Vier-Quadrant-Messungen
Guard Verhältnis	1:1000
3 Spannungsquellen	(AC/DC) 0 - 100 V
Frequenz	DC - 100 kHz
Strom	Bis zu 250 mA
Messung	
Spannung	(AC/DC) bis zu 100 V
Strom	(AC/DC) bis zu 100 mA
Widerstände	0,1 Ohm - 100 MOhm
Kondensatoren	1 pF - 100 mF
Induktivitäten	10 µH - 10 H
Kelvin Messung	
Diode und Zener Diode vorwärts und rückwärts bis zu 100 V	
Transistor, Optokoppler usw. im aktiven Test	
6-Bus Reed-Relais-Matrix (MUX)	

ANALOGES ODER HYBRIDES SYSTEM

Analoger ICT	Bis zu 3.456 Pins in 128-er Schritten
Hybrider digitaler Treiber/Sensor	Bis zu 3.456 Pins in 64/128-er Schritten
Input/Output	±10 V in 20 mV Auflösung
Max. Strom	±500 mA (Backdriving) oder 50 mA für den statischen I/O Betrieb
Tri-State Fähigkeit	
Automatische Treiber-Pegel-Überwachung	Treiber-Pegel pro Pin programmierbar

HARDWARE OPTIONEN

Programmierbare Spannungsquellen (UPC)	
Ausgangsspannung Auflösung	2,2 mV
Genauigkeit	20 mV
Strombegrenzung Auflösung	2,5 mA
Genauigkeit	±50 mA
Kurzschlussüberwachung über Soft- und Hardware	
Ausgang per Software zu- und abschaltbar	
Getrennte Force- und Sense-Leitungen	
Thermische Abschaltung	
UPC02-09	9 V / 10 A
UPC02-25	24 V / 5 A
UPC02-45	45 V / 3,5 A
Frequenz-/Zeitmesseinheit (MTC)	
Bis zu 100 MHz	
DC/AC Stromversorgung und Spannungsgleichrichter (MSM)	
Zusätzliche exakte U/I-Signalquellen (potentialfrei)	
Zusätzliche exakte U/I-Messung (potentialfrei)	
FailSim	
Automatische Überprüfung der Testprogrammqualität	
Externe Module	
Zum Beispiel IEEE, PXI, USB, RS232, CAN, LIN uvm.	

CITE TESTSYSTEM SOFTWARE (INKLUSIVE)

Programmentwicklung	Automatische Programm Generierung (APG) erstellt das Testprogramm aus der Baugruppenbeschreibung. Bibliothek für analoge und digitale IC's. Funktionstests erstellen mit Menu Aided Programming (MAP). Programmiercode des Testprogramms in Visual Basic (VB) 6, VB .NET und/oder als tabellenbasiertes GenFast. Übersetzung der Testprogramme von gängigen Testsystemen und der gesamten MTS-Serie. Aufzeichnung aller Testergebnisse für die Rückverfolgbarkeit (Fehlerdaten und/oder komplette Messwerte).
Programm Debugging	Leistungsfähiges Debugging mit dem tabellenbasierten GenFast (vor allem für analoge ICT) und/oder alle Funktionen die in VB 6 und VB .NET zur Verfügung stehen. Einzelschritt-Modus verfügbar. Debug-Fenster zur Anzeige der Messergebnisse. Alle Befehlsparameter können verändert und die Auswirkungen direkt sichtbar gemacht werden. Der Layout- und Schaltplan-Viewer (optional) sowie die Hervorhebung fehlerhafter Komponenten erleichtern das Debuggen.
Selbsttest	Prüft die Hardware und lokalisiert fehlerhafte Module (Diagnose auf Relais-Ebene).
QCAM (Teststabilitätsbericht)	Berichtet über die Testprogrammqualität und -stabilität; macht das Debuggen einfach und effizient.

SOFTWARE OPTIONEN

C-LINK Design to Manufacturing Software	Erstellt automatisch Adapterdaten, Netzlisten, Stücklisten, Layoutdaten usw.
QMAN Qualitätsmanagement-Software	Papierlose Reparatur, Statistiken, Qualitätsmanagement, Fehlerkatalog.
Boundary Scan	Integration Boundary Scan: Entwicklung, Umsetzung und Diagnose.
LabView und TestStand	Einbindung von National Instruments LabView oder TestStand möglich.

Das Unternehmen

Digitaltest ist ein starker Partner der Elektronikindustrie und verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung und Unterstützung automatisierter Testsysteme (ATE) für bestückte Leiterplatten. Das komplette Leistungsspektrum umfasst neben Technik und Hardware auch die notwendige Software zur Automatisierung der Produktion bis hin zur Qualitätsmanagement-Software.

Digitaltest GmbH

Lorenzstraße 3
76297 Stutensee
Telefon +49 7244 9640-0
E-Mail info@digitaltest.de

